


# ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY Nr/No AP 172

wydany przez / issued by  
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI  
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 21.02.2020

 AP 172	Nazwa i adres / Name and address <b>ZEPWN J. CZERWIŃSKI I WSPÓLNICY – SPÓŁKA JAWNA</b> <b>LABORATORIUM WZORCUJĄCE ZEPWN</b> ul. Kołłątaja 8 05-270 Marki
<b>Działalność prowadzona / Activity conducted</b> w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	<b>Wzorcowanie / Calibration:</b> Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of mesurand <sup>1)</sup> 12.01 siła <sup>1)</sup>

Wersja strony/Page version: A

<sup>1)</sup> Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl) / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)



KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI  
WZORCOWAŃ

*E. Grudniewicz*

ELŻBIETA GRUDNIEWICZ

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 172 z dnia 21.02.2020 r.

Cykl akredytacji od 13.01.2017 r. do 12.01.2021 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

This document is an annex to accreditation certificate No AP 172 of 21.02.2020  
Accreditation cycle from 13.01.2017 to 12.01.2021

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

Laboratorium Wzorujące ZEPWN ul. Kołłątaja 8, 05-270 Marki				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
<b>Siła</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• siłomierze</li> <li>• przetworniki               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ściskanie, rozciąganie</li> <li>- ściskanie</li> </ul> </li> </ul>	(1 – 5000) N (5 – 1000) kN	0,01 % 0,05 %	S	IW-S1-1 (PN-EN ISO 376:2011, VDI/VDE 2624 Part 2.1)

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

## Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 172

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK  
DZIAŁU AKREDYTACJI  
WZORCOWAŃ

*E. Grudniewicz*

ELŻBIETA GRUDNIEWICZ  
dnia: 21.02.2020 r.